

## 11.測試項目及合格標準-射頻載波調變之頻率偏移測試

### 11.1 測試目的

為驗證 EUT 射頻載波調變之頻率偏移在合格標準內。

### 11.2 合格標準

EUT 射頻載波調變之頻率偏移須符合下列合格標準。

Part1：正峰值應於 259kHz 至 403kHz，負峰值應於-403kHz 至-259kHz

Part2：正峰值應於 202kHz 至 403kHz，負峰值應於-403kHz 至-202kHz

Part3：正峰值應於 202kHz 至 403kHz，負峰值應於-403kHz 至-202kHz

Part4：平均值應於-17kHz 至 17kHz

### 11.3 測試方法

a.EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

b.選擇系統模擬設備(TBR06)中射頻載波調變之頻率偏移測試模式。

c.Part 1測試:

(a)LT 設定資料回傳模式，發射 0000111100001111 資訊。

(b)在鎖定通信後取樣大於 1s。

(c)量測頻寬須大於 3MHz，量測計算正向與負向之 f 與  $f_c$  之偏移值之峰值。

(d)依下列 EUT 類型之測試模式，重複(a)至(c)步驟:

EUT 類型	測試次數
僅有 A 資料場(A-Field)發射	100
半資料槽(Slot)發射	40
全資料槽發射	10
雙資料槽發射	5

d.Part 2 測試:

(a)發射資訊依下表改變:

EUT 類型	發射資訊
僅有 A 資料場(A-Field)發射	A-field，32 data，a16-31=1， a32-47=0
半資料槽(Slot) 發射	B-field，80 data， b0-b7：10101010，b8-b39=1， b40-b71=0，b72-b79=10101010
全資料槽 發射	B-field，320 data， b0-b127：1010...，b128-b191=1， b192-b255=0，b256-b319=1010...
雙資料槽發射	B-field，800 data， b0-b143=1010...， b144-b271=1，b272-b335=0， b336-b399=1，b400-b463=0， b464-b527=1，b528-b591=0， b592-b655=1，b656-b799=1010...

(b)量測頻寬須大於 3MHz，量測計算正向與負向之 f 與  $f_c$  之偏移值之峰值。

(c)依下列 EUT 類型之測試模式，重複(a)至(b)步驟:

EUT 類型	測試次數
僅有 A 資料場(A-Field)發射	100
半資料槽(Slot)發射	40
全資料槽 發射	10
雙資料槽 發射	5

e.Part 3 測試:

(a)LT 設定資料回傳模式，發射 0101010101010101 資訊。

(b)量測頻寬須大於 3MHz，量測計算前 16bits 同步信號與回傳信號之 f 與  $f_c$  之偏移值之峰值。

(c)依下列 EUT 類型之測試模式，重複(a)至(b)步驟:

EUT 類型	測試次數
僅有 A 資料場(A-Field)發射	100

半資料槽(Slot)發射	40
全資料槽 發射	10
雙資料槽 發射	5

f. Part 4 測試:

- (a)LT 設定資料回傳模式，發射 0101010101010101 資訊。
- (b)在鎖定通信後取樣大於 1s，量測頻寬須大於 3MHz。
- (c)量測計算前 16bits 同步信號之前 14 bits 之平均頻率  $f_s$ 。
- (d)量測計算前 16bits 回傳信號之前 14 bits 之平均頻率  $f_l$ 。
- (e)重複 200 次測試步驟(a)至(e)，計算  $f_l-f_s$  之平均頻率偏移。
- g.測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果儲存。
- h.設定頻道 $c=2$ 及 $9$ ，重複b至g步驟。

11.4 測試規定

測試條件如附錄一，並依附錄二接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若 EUT 有天線接頭，則應由該處接至 LT。